



订购资讯

3312 : 通讯变压器测试系统
A110104 : SMD测试线#17
A110211 : 零组件测试盒
A110212 : 零组件远端测试盒
A110234 : 高频测试线

A110239 : 四端SMD电解电容测试盒(有专利)
A132501 : 变压器自动扫描测试盒
A133004 : SMD测试盒
A133006 : 1A重迭电流源装置

特点

- 具通讯变压器检测所需之各项量测功能
- 测试频率20Hz~1MHz，精确度0.02%
- 基本量测准确度0.1%
- 三种阻抗输出模式选择，量测结果与各家知名厂牌之LCR表完全比对
- 增强式圈数比(Turn Ratio)准确量测，适用于低磁导率之磁心
- 高速电感量/圈数比量测，最快80次/秒
- 高速DCR量测，最快50次/秒
- 1320直流重迭电流源直接控制功能
- 大型LCD显示(320x240点矩阵)
- 提供各式标准测试治具及特殊治具订制
- 四端测试治具，可得到DCR，电感量和圈数比之精确且稳定之量测
- 内建式比较器；10级分类(BIN SORTING)及计数功能
- 4M SRAM记忆卡供机台资料设定及备份
- 标准RS232，HANDLER，PRINTER介面，支援LCR功能GPIB介面(选购)
- 15组内部仪器设定可供储存及呼叫

3312变压器测试系统，为一提供通讯变压器生产或品管进出料检验，具有高稳定度及高可靠度之精密量测仪器。

3312提供20Hz-1MHz测试频率。在通讯变压器扫描测试功能之外提供LCR Meter功能。在通讯变压器扫描测试项目上，涵盖各式通讯变压器之低压测量参数。包括反射损失(R L O S)、反射阻抗(Z r)、插入损失(I L O S)、频率响应(F R)、纵向平衡(LBAL)等通讯规格测试项；电感量，漏感量，圈数比，直流电阻，阻抗，线圈间容量等一般变压器之测量主参数；品质因素，串联等效电阻等一般变压器之测量副参数，以及出脚短路检查等。高速数位取样技术及扫描测试治具(A132501)设计，使以往费时低效率的通讯变压器生产检验变得精确又快速。

3312更提供多种输出阻抗模式的选择，使得测试仪器间因测试输出阻抗差异造成测试电流不同而引起之量得电感量差异之问题得以解决。

规格表		
Model		3312
Main Function		Transformer Scanning Test + LCR Meter
Test Parameter		
Transformer Scanning		Turn Ratio (TR), Phase, Turn Inductance (L), Quality Factor (Q), Leakage Inductance (LK), Inductance Balance (BL), ACR, Capacitance, DCR, Pin Short, Return Loss (RLOS), Insertion Loss (ILOS), Frequency Response (FR), Longitudinal balance (LBAL)
LCR Meter		L, C, R, IZL, Y, DCR, Q, D, R, X, θ
Test Signals Information		
Test Level	Turn, ILOS, Fr, LBAL	10mV ~ 10V, $\pm 10\%$ 10mV/step
	Others	10mV ~ 2V, $\pm 10\%$ 10mV/step
Test Frequency	Turn	1kHz ~ 1MHz, $\pm (0.1\% + 0.01\text{Hz})$, Resolution : 0.01 Hz
	Others	20Hz ~ 1MHz, $\pm (0.1\% + 0.01\text{Hz})$, Resolution: 0.001 Hz (<1kHz)
Output Impedance	Turn, ILOS, Fr, LBAL	10 Ω , when level $\leq 2\text{V}$; 50 Ω , when level > 2V
	Others	Constant = OFF : Varies as range resistors Constant = 320X : 100 $\Omega \pm 5\%$ Constant = 107X : 25 $\Omega \pm 5\%$ Constant = 106X : 100mA $\pm 5\%$ (1V setting), for inductive load less than 10 Ω , 10 $\Omega \pm 10\%$, for impedance $\geq 10\Omega$
Measurement Range		
Lx, x		0.00001 μH ~ 9999.99H
C		0.00001pF ~ 999.999mF
Q, D		0.00001 ~ 99999
Z, X, R		0.00001 Ω ~ 99.9999M Ω
Y		0.01nS ~ 99.9999S
θ		-90.00° ~ +90.00°
DCR		0.01m Ω ~ 99.999M Ω
Turn		0.01 ~ 99999.99 turns (Secondary voltage less than 100 Vrms)
Pin-Short		11 pairs, between pin to pin
RLOS, ILOS, FR		-100dB ~ +100dB
LBAL		0dB ~ +100dB
Basic Accuracy		
L, LK, C, Z, X, Y, R		$\pm 0.1\%$ (1kHz if AC parameter)
DCR		$\pm 0.5\%$
θ		$\pm 0.03\%$ (1kHz)
Turn		$\pm 0.5\%$ (1kHz)
RLOS		N/A (Zr : $\pm 0.1\%$)
ILOS, FR, LBAL		$\pm 0.5\text{dB}$
Measurement Speed (Fastest)		
L, LK, C, Z, X, Y, R, Q, D, θ		80meas./sec.
DCR		50meas./sec.
Turn, RLOS, ILOS, LBAL		10meas./sec.
Judge		
Transformer Scanning		PASS/FAIL judge of all test parameters output from Handler interface
LCR Meter		10 bins for sorting & Bin sum count output from optional Handler interface PASS/FAIL judgement output from standard Handler interface
Trigger		Internal, Manual, External
Display		320x240 dot-matrix LCD display
Equivalent Circuit Mode		Series, Parallel
Correction Function		Open/Short Zeroing, Load correction
Memory		15 instrument setups, expansion is possible via memory card
General		
Operation Environment		Temperature: 10°C ~ 40°C, Humidity: 10%~90% RH
Power Consumption		140 VA max.
Power Requirement		90 ~ 132Vac or 180 ~ 264Vac, 47 ~ 63Hz
Dimension (H x W x D)		177 x 430 x 300 mm / 6.97 x 16.93 x 11.81 inch
Weight		9.2 kg / 20.26 lbs

视频与色彩
平面显示器
LED照明
光学元件
及自动化
太阳光电
自动光学检测
电力电子
及电池测试
被动元件
电气安规
半导体IC
量测
通用及可靠度
智慧制造系统
整合式量测及自动化